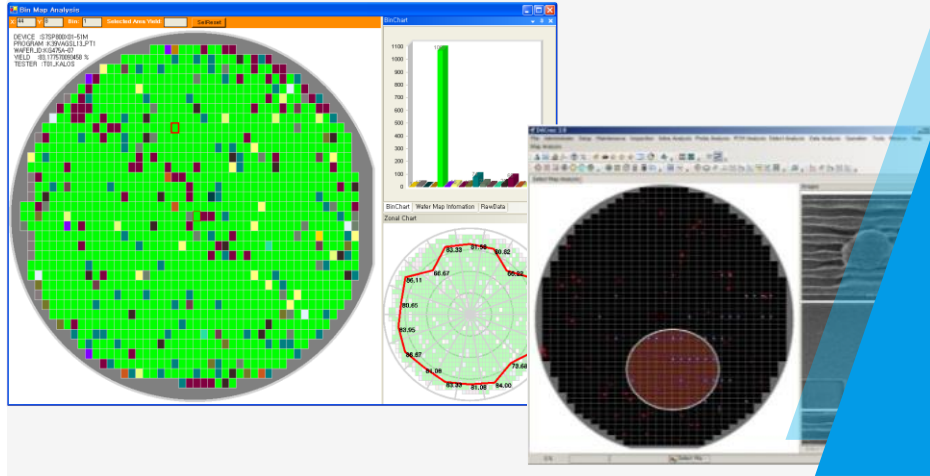


반도체 품질분석에 의한 수율 향상

FAB, Wafer, Commonality, Defect Map Analysis, Wafer Map Analysis



Project Description

- 고객 : 반도체 Wafer 가공 공정
- 솔루션 : Nexplant QMS(YMS, DMS)
- 범위 : 수율분석

01 The Challenge

- 반도체 특화 품질분석 시스템 고도화 필요
특화기능 보유한 솔루션 필요
- 다량의 데이터에 대한 체계적 적재 필요
- 수율 저하 원인을 신속, 정확하게
찾는 로직이 필요

02 The Solution

- 수율 저하 요인 분석기능 제공(공정, 설비 등)
Test결과 자동수집 및 분석기능 제공
- Defect Map 자동 수집 분석기능
- Defect Image 분석 기능 제공

03 Benefits

- 반도체 특화 분석 기능 제공
- Wafer Map 데이터 분석에 따른
수율 저하 경향성 분석
- Defect Map 분석으로 Defect 발생원인 및
취약공정 분석